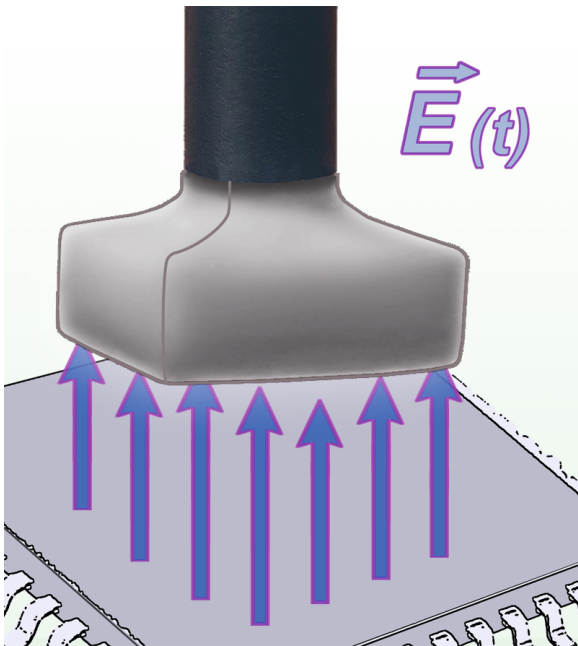


# XFS-E 09s

Scannerprobe 30 MHz bis 6 GHz



## Kurzbeschreibung

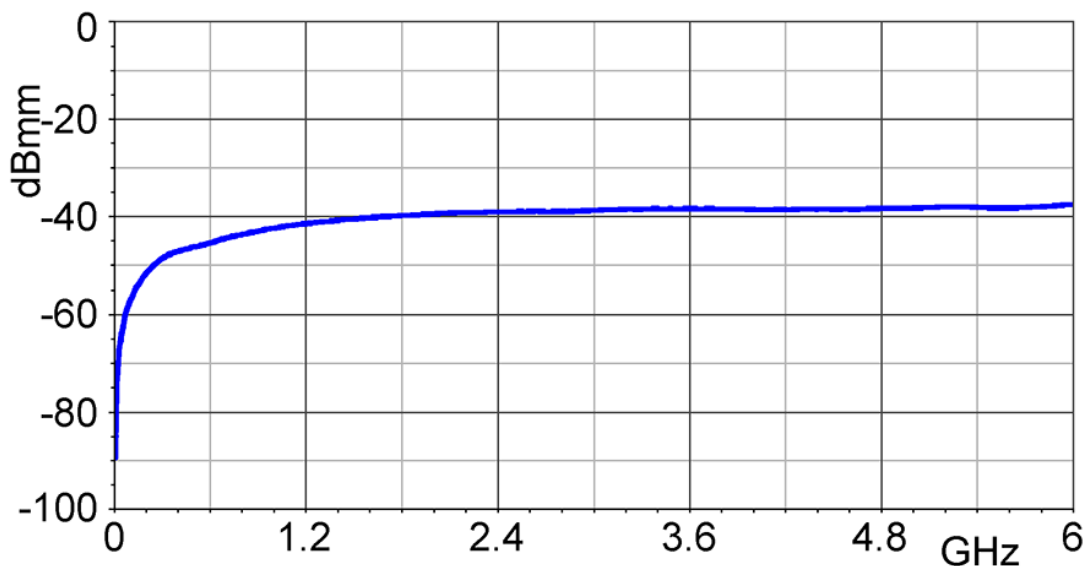
Die Elektrode am Sondenkopf der Scannerprobe XFS-E 09s erfasst elektrische Felder, die z. B. oberhalb der IC-Oberfläche ausgekoppelt sind. Die Auflösung der Sonde ermöglicht Messungen in einem Abstand von 0,5 mm bis 10 mm über einer Baugruppe. Zur Messung wird die E-Feldsonde auf das Messobjekt aufgesetzt.

Die XFS-E 09s ist eine passive Nahfeldsonde. Typischerweise wird der Sondenkopf direkt auf das Messobjekt aufgesetzt (hohe elektrische Feldstärke). Die Nahfeldsonde hat eine Mantelstromdämpfung und ihre Oberseite ist elektrisch geschirmt. Sie wird an einen Spektrumanalysator oder ein Oszilloskop mit 50  $\Omega$  Eingang angeschlossen. Die E-Feldscannerprobe besitzt intern einen Abschlusswiderstand.

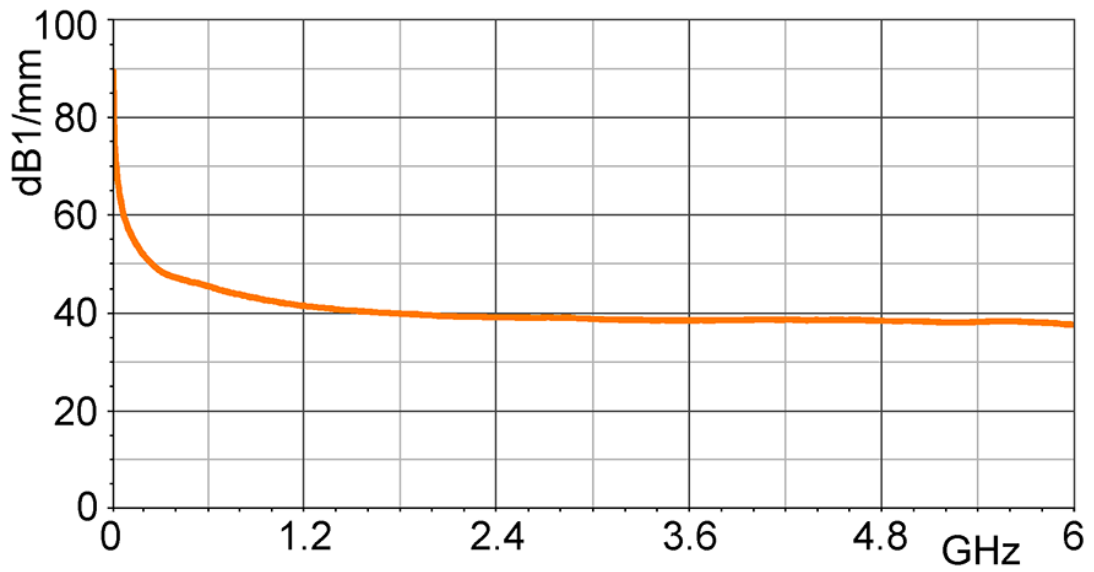
## Technische Parameter

Frequenzbereich	30 MHz ... 6 GHz
Auflösung	$\approx 0.2$ mm
Maße Sondenkopf	$\approx (10 \times 10)$ mm
Anschluss - Ausgang	SMA, male, jack

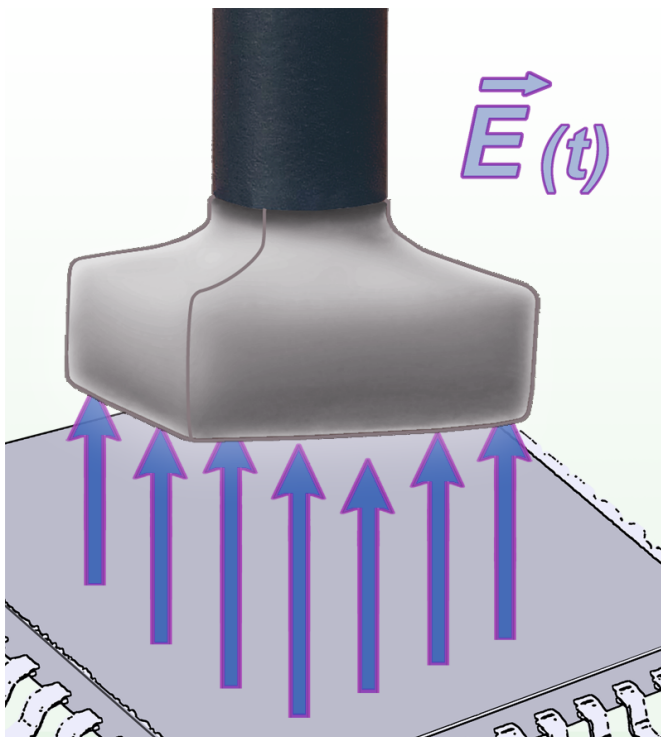
Frequenzgang [dB $\mu$ V] / [dB $\mu$ A/m]



Korrekturkurve E-Feld [dB $\mu$ V/mm] / [dB $\mu$ V]



Messprinzip



# XFS-E 09s

Scannersonde 30 MHz bis 6 GHz

**LANGER**  
EMV-Technik

